

NI senkt Kosten für Produktionsprüfung von Mobilfunkgeräten

5. August 2015
Austin, Texas – [NIWeek](#)
zur sofortigen Veröffentlichung

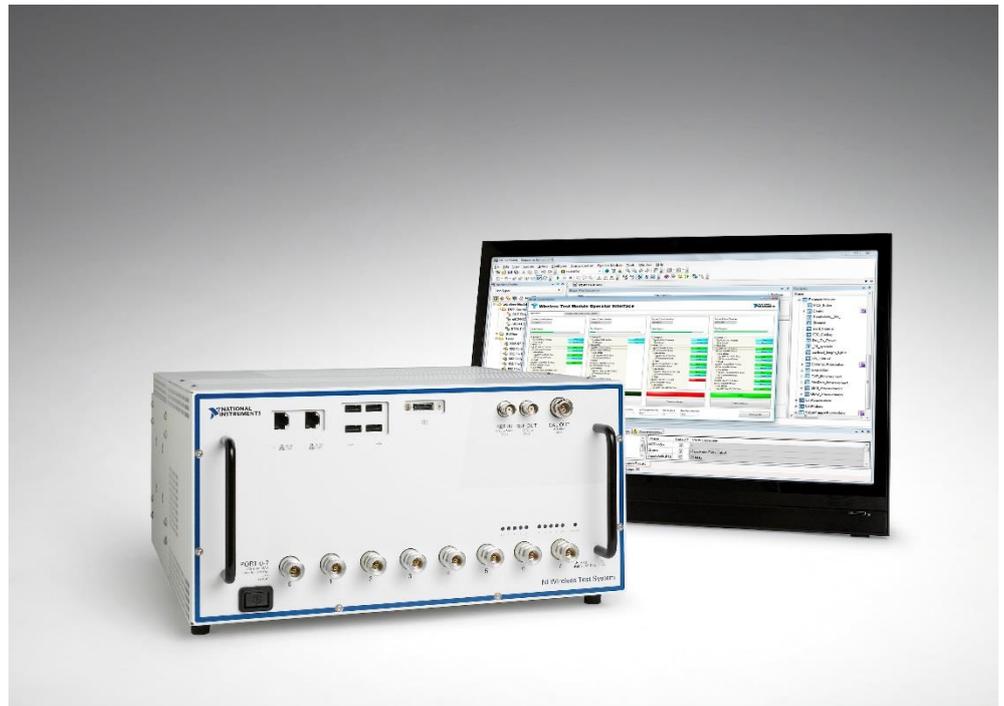
*Das neue PXI-basierte Wireless Test System ist auf Geschwindigkeit
optimiert und vervielfacht den Durchsatz in der Produktion.*

Pressekontakt

Eva Heigl
Marketing Communications Manager
Central European Region
Tel.: +49 89 741313-184
eva.heigl@ni.com

Stefan Ambrosch
Ad & PR Specialist
Tel.: +49 89 741313-136
stefan.ambrosch@ni.com

Florian Schultz
Ad & PR Specialist
Tel.: +49 89 741313-294
florian.schultz@ni.com



Kundenkontakt

Deutschland:
National Instruments Germany GmbH
Ganghoferstraße 70 b
80339 München
Tel.: +49 89 7413130
Fax: +49 89 7146035
ni.com/germany
info.germany@ni.com

Österreich:
National Instruments GesmbH
Plainbachstraße 12
5101 Salzburg-Bergheim
Tel.: +43 662 457990-0
Fax: +43 662 457990-19
ni.com/austria
ni.austria@ni.com

Schweiz:
National Instruments Switzerland GmbH
Sonnenbergstrasse 53
5408 Ennetbaden
Tel.: +41 56 2005151
Fax: +41 56 2005155
ni.com/switzerland
ni.switzerland@ni.com

Pressemitteilung, 4. August 2015 – NIWeek – National Instruments (Nasdaq: NATI) trägt mit seinen Systemen für Ingenieure und Wissenschaftler zur Bewältigung der weltweit größten technischen Herausforderungen bei. Das Unternehmen stellt heute das [Wireless Test System](#) (WTS) vor, eine Lösung, mit der die Kosten für Produktionstests von Mobilfunkgeräten in der Großserienfertigung deutlich gesenkt werden. Trotz zunehmender Komplexität der Tests von Mobilfunkgeräten können Unternehmen die Testkosten ohne Weiteres reduzieren und den Durchsatz in der Produktion vervielfachen. Dies wird durch den Einsatz von Systemen möglich, die für Messgeschwindigkeit und paralleles Testen optimiert sind.

„Megatrends wie das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) werden dazu führen, dass in mehr und mehr Geräten RF- und Sensorfunktionalität enthalten sein wird, deren Test bisher kostenaufwendig war. Doch die Testkosten sollten nicht die Innovationen oder die Wirtschaftlichkeit eines Produkts begrenzen“, erklärt Olga Shapiro, Program Manager for Measurement and Instrumentation bei Frost & Sullivan. „Um in Zukunft profitabel zu bleiben, werden Unternehmen ihre bisherigen Vorgehensweisen überdenken und für völlig neue Ansätze im Bereich Mobilfunktest offen sein müssen. Da das WTS auf der bewährten PXI-Plattform basiert und auf der guten Kenntnis des Marktes von NI beruht, erwarten wir, dass es einen deutlichen Einfluss auf die Profitabilität des IoT haben wird.“

Auf Basis der neuesten Hardwareentwicklungen der PXI-Plattform bietet das WTS eine durchgängige Plattform für das Testen mehrerer Standards und mehrerer Prüflinge mit jeweils einem oder mehreren Anschlüssen. Zusammen mit flexibler Software zur Entwicklung von Testplänen wie dem TestStand Wireless Test

Module können Hersteller die Auslastung ihrer Messgeräte wesentlich verbessern, indem sie mehrere Prüflinge parallel testen. Wegen seiner integrierten Ansteuerung der Prüflinge, den Mechanismen zur dezentralen Automatisierung sowie fertiger Testpläne für Chipsätze von Herstellern wie Qualcomm und Broadcom lässt sich das WTS einfach in eine Fertigungslinie integrieren. Aufgrund dieser Besonderheiten verzeichnen Anwender beträchtliche Effizienzsteigerungen bei der Nutzung ihrer RF-Prüfgeräte und weitere Senkungen der Testkosten.

„Wir sind in der Lage, mit dem NI Wireless Test System sämtliche drahtlosen Standards, von Bluetooth über WLAN bis hin zu GPS und Mobilfunk, mit ein und demselben Gerät zu testen“, erklärt Markus Krauss, HARMAN/Becker Automotive Systems GmbH. „Das WTS sowie das Know-how von NOFFZ auf dem Gebiet der HF-Testsysteme haben es uns ermöglicht, die Testzeit sowie die Einrichtungs- und Inbetriebnahmezeit unserer Testsysteme deutlich zu reduzieren.“

Das WTS ist das neueste System von NI, das auf der PXI-Hardwareplattform und der Software LabVIEW sowie TestStand basiert (vergleichbar mit dem [Semiconductor Test System](#), das 2014 auf den Markt gebracht wurde). Es unterstützt Funkstandards von LTE Advanced über 802.11ac bis hin zu Bluetooth Low Energy und ist für Produktionstests von WLAN Access Points, Mobilfunkgeräten und Infotainment-Systemen sowie für Produktionstests aller möglichen anderen Geräte ausgelegt, in die z. B. Mobilfunk-, WLAN- oder Navigationsfunktionen integriert sind. Die im WTS verwendete SDR-Technologie des PXI-[Vektorsignal-Transceivers](#) ermöglicht bessere RF-Leistungsmerkmale bei Produktionstests und schafft eine Plattform, die flexibel an die wechselnden Anforderungen an RF-Tests angepasst werden kann.

Weitere Informationen zum neuen Wireless Test System bietet die Website ni.com/wts.

Über National Instruments

Seit 1976 ermöglicht NI (ni.com) Ingenieuren und Wissenschaftlern, die weltweit größten technischen Herausforderungen mit leistungsstarken, flexiblen Systemen zu bewältigen, mit denen sie schneller produktiv arbeiten und Innovationen zügiger realisieren können. Kunden aus einer Vielzahl von Branchen – vom Gesundheitswesen bis zur Automobilindustrie sowie von der Unterhaltungselektronik bis hin zur Teilchenphysik – nutzen die integrierte Hard- und Softwareplattform von NI, um unsere Welt noch lebenswerter zu machen.